

## Nano Indenter

# in-situ Indenter + Heliosセミナーのご案内

共催：サーモフィッシャーサイエンティフィック  
ブルカージャパン

微小領域における物性評価として、ナノインデンテーションが注目されています。これまで困難であった微視的な力学特性評価は、ナノインデンテーションシステムの小型化および精緻化によって、また電子顕微鏡観察技術の向上によって、評価することが可能になってきました。走査電子顕微鏡(SEM)内でのナノインデンテーションが明らかにするナノ力学評価は、新たなナノ力学特性およびナノトライロジー特性を定量的に評価すると共に、ナノスケールでの力学挙動をより正確にin-situ観察することができます。

今回はブルカー社製 In-situ ナノインデント PI89とDualBeamシステムを用いたデモンストレーションを行います。加えて最新のDualBeamシステムのラインナップや微細構造評価技術のご紹介いたします。

最新のソリューションを是非実際にお確かめください。

開催日時： 2026年3月27日(金) 13:00 – 17:15 参加費：無料  
会場： 品川ナノポート(品川区東品川4-12-2 品川シーサイドウエストタワー1F)  
定員： 15名 (定員になり次第締め切ります。)  
申込フォーム： <https://forms.office.com/r/yC39LBx6hr> (3月23日締切)

12:30-13:00	受付	Thermo Fisher Scientific
13:00-13:05	開会挨拶	Thermo Fisher Scientific
13:05-14:00	材料の小型化・薄膜化時代における機械特性評価： ナノインデンテーション基礎と SEM/TEM in-situ ナノメカニクス評価	ブルカージャパン株式会社 二軒谷 亮
14:00-14:30	薄膜半導体の機械特性評価とdual-beam技術(+ナノインデント+CL)	三菱ケミカル株式会社 松本 創 様
14:30-14:45	休憩	
14:45-16:45	Helios およびナノインデンテーションデモ	Thermo Fisher Scientific Tokyo Nanoport Team・ ブルカージャパン
16:45-17:05	Thermo Fisher Scientific DualBeamのご紹介	Thermo Fisher Scientific 石丸 雅大
17:05-17:15	閉会挨拶およびアンケート	

▼登録フォーム QRコード



共催各社プライバシーポリシーは、下記サイトをご参照ください。

サーモフィッシャーサイエンティフィック: <https://www.thermofisher.com/jp/en/home/global/privacy-policy.html>

ブルカージャパン: <https://www.bruker.com/ja/legal/privacy-policy.html>

詳細はこちらをご覧ください <https://www.bruker-nano.jp/nano-indentation>